УДК 681.2

## СИНУСОИДАЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ФОТО-ЭДС Микитевич В.А., Жарин А.Л.

Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь

**Аннотация.** При измерении поверхностной фото-ЭДС важно значение оказывает форма модуляции светового излучения. При использовании прямоугольной модуляции усложняется обработка выходного сигнала и появляется погрешность измерения. Синусоидальная модуляция позволяет упростить обработку выходного сигнала.

Ключевые слова: поверхностная фото-ЭДС, модуляция светового излучения.

## SINUSOIDAL MODULATION OF LIGHT RADIATION WHEN MEASURING THE SURFACE PHOTOVOLTAGE Mikitsevich U., Zharin A.

Belarusian National Technical University Minsk, Republic of Belarus

**Abstract.** When measuring surface photovoltage, the form of modulation of light radiation is important. When using rectangular modulation, the processing of the output signal becomes more complicated and a measurement error appears. Sinusoidal modulation allows you to simplify the processing of the output signal. **Key words:** surface photovoltage, light modulation.

Адрес для переписки: Микитевич В.А., пр. Независимости, 65, Минск 220113, Республика Беларусь e-mail: mikitevichva@bntu.by

Для измерения поверхностной фото-ЭДС бесконтактным методом требуется модуляция светового излучения. В зависимости от формы модулируемого светового излучения зависит форма выходного сигнала. Обычно величина сигнала очень мала и сравнима с уровнем шумов, что требует фильтрации и усиления [1].

В случае применения модуляции светового излучения прямоугольной формы изменение концентрации неравновесных носителей заряда (ННЗ) будет выполняться в соответствии со выражениями (1) и (2):

$$\frac{\Delta n}{\Delta n_{\rm cr}} \sim 1 - e^{-\frac{t}{\tau}},\tag{1}$$

$$\frac{\Delta n}{\Delta n_{\rm cr}} \sim e^{-\frac{t}{\tau}},\tag{2}$$

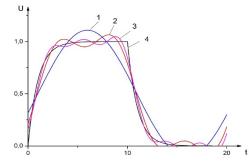
где  $\Delta n$  — концентрация неравновесных носителей заряда;  $\Delta n_{\rm cr}$  — концентрация неравновесных носителей заряда в стационарном режиме;  $\tau$  — время жизни неравновесных носителей заряда.

Если выполнять измерения поверхностной фото-ЭДС при воздействии прямоугольными импульсами, то сигнал в измерительной цепи будет иметь экспоненциальную форму. В процессе фильтрации сигнала будет происходить искажение формы выходного сигнала, что приводит к погрешности измерения. Моделирование выходного сигнала при использовании фильтров с разной постоянной времени приведено на рис. 1.

Модуляции светового излучения, которое будет изменяться по синусоидальному закону определяется следующим выражением:

$$I = I_{\text{amil}} \cdot (1 - \cos(\omega \cdot t)), \tag{3}$$

где  $I_{\text{амп.}}$  — амплитудное значение интенсивности светового излучения;  $\omega$  — циклическая частота, определяется выражением.



1, 2, 3 – моделирование сигнала после фильтрации; 4 – исходный идеальный сигнал

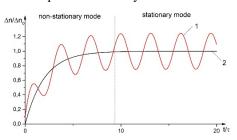
Рисунок 1 – Измерительный сигнал после фильтрации

Тогда изменение концентрации носителей заряда также будет происходить по синусоидальному закону в соответствии со следующим выражением:

$$\Delta n = \beta \cdot k \cdot I_{\text{amii.}} \cdot \tau \left( 1 - \frac{2 + (\tau \cdot \omega)^{2}}{1 + (\tau \cdot \omega)^{2}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right) + \frac{\beta \cdot k \cdot I_{\text{amii.}} \cdot \tau}{1 + (\tau \omega)^{2}} (\tau \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) + \cos(\omega t)).$$
(4)

На рис. 2 представлена временная зависимость изменения концентрации ННЗ при воздействии светового излучения синусоидальной формы. Первое слагаемое выражения (4) описывает изменение среднего значения концентрации ННЗ (рис. 2 кривая *I*). Второе слагаемое выражения (4) описывает изменение концентрации ННЗ в установившемся режиме.

Откликом на синусоидальное изменение концентрации ННЗ будет синусоидальный сигнал. Любое изменение формы сигнала свидетельствует о нестационарном режиме работы. Такой сигнал значительно проще усиливать, фильтровать от помех. Построение усилителей сигналов синусоидальной формы значительно проще построения широкополосных усилителей.



I – кривая изменения концентрации ННЗ;
 2 – усредненное значение кривой изменения концентрации ННЗ

Рисунок 2 – Временная зависимость изменения концентрации ННЗ при воздействии светового излучения синусоидальной формы

При измерении поверхностной фото-ЭДС бесконтактным методом очень важно получение максимальной амплитуды выходного сигнала. Поэтому важно увеличение амплитуды переменной составляющей выражения (3). К постоянной составляющей бесконтактные методы измерения нечувствительны. Однако можно попасть в область насыщения (кривая 3 рис. 4). В результате произойдет искажение кривой *I* (рис. 3). Время релаксации ННЗ после насыщения обычно несколько больше, что приводит к увеличению времени переходных процессов.

Второй способ увеличения амплитуды выходного сигнала заключается в том, чтобы уменьшить постоянную составляющую концентрации ННЗ. При этом переменная концентрация ННЗ будет находиться в диапазоне между равновесной и границей насыщения полупроводника. Это возможно при уменьшении постоянной составляющей светового излучения. На рис. 4 представлено несколько вариантов изменения светового излучения. Кривые 1, 2 и 3 соответствует следующему выражению:

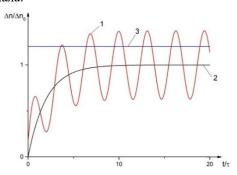
$$I = S + I_{\text{amp.}} \cdot (1 - \cos(\omega \cdot t)), \tag{5}$$

где S — постоянное смещение.

Смещение может принимать следующие значения: S > 0 (рис. 5 кривая I); S = 0 (рис. 5 кривая 2); S < 0 (рис. 6 кривая 3).

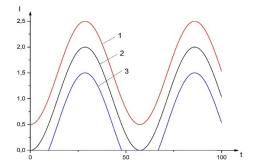
При S > 0 возникает постоянная засветка исследуемого образца. Это может привести к выходу в зону насыщения полупроводника (рис. 4).

При S < 0 в соответствии с выражением (5) I в некоторые моменты времени будет принимать отрицательное значение. Однако световой поток не может быть меньше нуля. Поэтому отрицательное смещение приведет к искажению формы светового излучения, а следовательно, и выходного сигнала.



1 – расчетная кривая изменения концентрации ННЗ;
 2 – среднее значение кривой изменения концентрации ННЗ;
 3 – кривая насыщения полупроводника

Рисунок 3 — Временная зависимость изменения концентрации ННЗ при воздействии светового излучения синусоидальной формы



1, 2, 3 – кривые с разными значениями постоянного смещения

Рисунок 4 — Кривая интенсивности светового излучения

При S=0 световое излучение находится в диапазоне от нуля до  $I_{\rm амп}$ . Это позволяет исключить постоянную засветку и уменьшить постоянную составляющую в выходном сигнале.

## Литература

1. Растровая сканирующая фотостимулированная электрометрия для контроля прецизионных поверхностей / Р. И. Воробей [и др.] // Известия ТулГУ. Технические науки. — 2021. — N2. 10. — C. 66—73.